



Собственная линейка оборудования компании «Ксиллект» включает координатно-измерительную технику и лабораторные и научно-исследовательские системы – серию сканирующих зондовых микроскопов N-lekta.

**N-lekta LR200** – атомный силовой микроскоп для проведения измерений с образцами до 200×200 мм. Максимальная толщина образца – 40 мм, при этом повторяемость позиционирования – не более 1 мкм.



**Высокое качество изображения**



**50+ методик в базовой конфигурации**



**Автоподбор параметров сканирования**



**Автоматическая программа измерений**



**Измерение больших образцов**

### Технические характеристики LR200

Диапазон сканирования XYZ	90x90x9 мкм (±10%)
Диапазон моторизованного перемещения образца по осям X, Y	200x200 мм
Максимальный размер образца (ДхШхВ)	200x200x30 мм
Максимальная скорость позиционирования	5 мм/с
Точность позиционирования в плоскости XY ≤	1 мкм